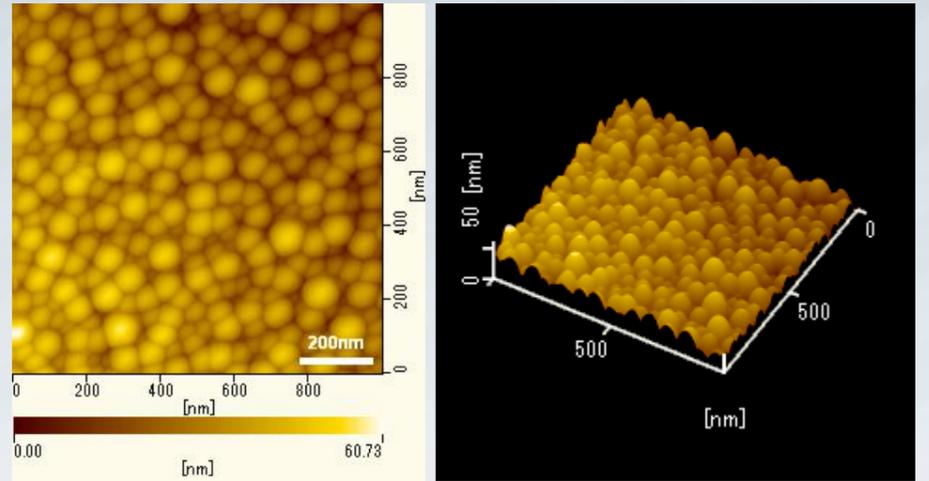


走査型プローブ顕微鏡(SPM) 機器講習会



E-SWEEP(日立ハイテクサイエンス)

SPMは、微小な探針と試料の間に発生する相互作用を検出しながら走査することで、その形状や性質を観察することの出来る顕微鏡で、原子・分子レベルの分解能を有しています。

これから走査型プローブ顕微鏡の使用を検討されている方は、是非機器講習会にご参加ください。

日時：平成30年**7月12日(木)** **13:30~15:30頃**

場所：理系複合棟 309室

機種：E-SWEEP (日立ハイテクサイエンス)

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=53 (分析機器一覧)

講師：岡田 竜弥先生 (工学部)

内容：
・ 機器の原理
・ 基本的な観察方法(AFM,DFM)

定員：7名

※ 定員に達し次第、受付を終了しますので、使用予定者は早めに申し込んでください。

申込方法



QRコード又は**下記ホームページ**から申込をしてください。
(締切は、**7月11日(水) 15:00**まで)

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=100

観察サンプルの持込を希望する方は、申込時にその旨をお知らせください。詳細を問い合わせることがありますが、予めご了承ください。

問い合わせ先

研究基盤センター事務室 (理系複合棟307号室) 泉水 仁

TEL:[895-8967](tel:895-8967) E-mail:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>